,	S	e	ar	C	h	I	N	0	te	S	
	11	111	E11		***			11		181	•



Application/Con	trol	Nọ.
-----------------	------	-----

10/623,195 Examiner

Allen Wong

Applicant(s)/Patent under Reexamination

LEE ET AL Art Unit

2621

	SEAR	CHED ;	
Class	Subclass	Date	Examiner
375	240.25	12/7/2006 i	. AW
375	240	12/7/2006	AW
375	240.01	12/7/2006 i	AW _
375	240.12	12/7/2006	AW
375	240.16	12/7/2006	AW
			i • 1•
		1	æ
, 			<i>i</i>
			ly say
			*
		:	

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
		!	• ., •		
	`				

(INCLUDING SEARCH S	11041201	
	DATE	EXMR'
		1
		•
and the transfer of		· /
alse di la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
in the second of		1 /
		
	·	
		' /
		1 /
	. [,